【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成26年7月3日(2014.7.3)

【公表番号】特表2012-523030(P2012-523030A)
【公表日】平成24年9月27日(2012.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2012-039
【出願番号】特願2012-502602(P2012-502602)
【国際特許分類】
Ｇ０６Ｔ　1/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０６Ｔ　1/00　２８５

【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年5月2日(2014.5.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
合成開口レーダ（ＳＡＲセンサ）を用いて、同一領域上で取得された画像内の統計的に均質な画素を識別する方法であって、次のステップを備える方法。
(a) 同一領域上でＳＡＲセンサを用いて、Ｎ個のレーダ画像（Ａ１…ＡＮ）を取得するステップと、
(b) １つの画素を選択してサンプル画素（１）として識別するステップと、
(c) 前記方法はステップ(c)後の次のステップを備えることを特徴付けられており、共通グリッドでのデータのリサンプリングを許容するのに好適な取得形状をもって行われる前記取得ステップ(a)、及び共通のグリッドでのデータのリサンプリングの後に行われる前記ステップ(b)を特徴とする、サンプル画素の近辺の画素セットを識別するために、サンプル画素に対して推定窓（１０）を規定するステップと、
(d) Ｎ個の利用可能な画像におけるサンプル画素についてＮ個の振幅値又は強度値のベクトルを計算し、そのベクトルをサンプルベクトルとして識別するステップと、
(e) サンプル画素に対して行ったのと同じように、推定窓内に含まれる全ての画素に対してＮ個の振幅値又は強度値のベクトルを計算するステップと、
(f) 推定窓に属する全ての振幅値又は強度値のベクトルを、統計的検定を用いてサンプルベクトルと比較して、いずれの振幅値又は強度値のベクトルが、サンプルベクトルと同じ確率分布関数により生成されるかを検定するステップと、
(g) 振幅値又は強度値のベクトルに関連しかつステップ(f)の検定に合格した画素を、サンプル画素と均質な画素（２、３）であると識別するとともに、振幅値又は強度値のベクトルに関連しかつステップ(f)の検定に合格しなかった画素を、サンプル画像と均質ではない画素（４）であると識別するステップと、
(h) 均質な画素（２、３）のサンプル画素への連結検定を達成するステップと、
(i) 推定窓（１０）に含まれている画素において、振幅値又は強度値のベクトルに関連しかつステップ(f)の検定に合格していても、直接的にあるいはサンプル画素と均質な他の画素を介して、サンプル画素に連結していないためサンプル画素と均質ではない画素を除去するステップと、
(j) サンプル画素と均質かつ連結している画素を、統計的に均質な画素として識別するステップ。

【請求項２】
ベクトルの全ての振幅値が、
式
$$A=\sqrt{\mathrm{Re}^2+\mathrm{Im}^2}$$
により計算される請求項１に記載の方法。但し、Ａは振幅値、Ｒｅは画素に関連する複素数の実部、Ｉｍは前記複素数の虚部を示す。
【請求項３】
ベクトルのすべての強度値が、
式
$$A^2=\mathrm{Re}^2+\mathrm{Im}^2$$
により計算される請求項１に記載の方法。但し、A^2は振幅の自乗値、Ｒｅは画素に関連する複素数の実部、Ｉｍは前記複素数の虚部を示す。
【請求項４】
ＳＡＲにより取得された前記Ｎ個の画像が、異なる時点で取得される請求項１に記載の方法。
【請求項５】
ＳＡＲにより取得された前記Ｎ個の画像が、異なる視角で取得される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
ステップ(f)における比較が、コルモゴロフ-スミルノフ検定を用いて行われる請求項１に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
(a) 同一領域上でＳＡＲセンサを用いて、Ｎ個のレーダ画像（Ａ１…ＡＮ）を取得するステップと、
(b) １つの画素を選択してサンプル画素（１）として識別するステップと、
(c) 前記方法はステップ(c)後の次のステップを備えることを特徴付けられており、共通グリッドでのデータのリサンプリングを許容するのに好適な取得形状をもって行われる前記取得ステップ(a)、及び共通のグリッドでのデータのリサンプリングの後に行われる前記ステップ(b)を特徴とする、サンプル画素の近辺の画素セットを識別するために、サンプル画素に対して推定窓（１０）を規定するステップと、
(d) Ｎ個の利用可能な画像におけるサンプル画素についてＮ個の振幅値又は強度値のベクトルを計算し、そのベクトルをサンプルベクトルとして識別するステップと、
(e) サンプル画素に対して行ったのと同じように、推定窓内に含まれる全ての画素に対してＮ個の振幅値又は強度値のベクトルを計算するステップと、
(f) 推定窓に属する全ての振幅値又は強度値のベクトルを、統計的検定を用いてサンプルベクトルと比較して、いずれの振幅値又は強度値のベクトルが、サンプルベクトルと同じ確率分布関数により生成されるかを検定するステップと、
(g) 振幅値又は強度値のベクトルに関連しかつステップ(f)の検定に合格した画素を、サンプル画素と均質な画素（２、３）であると識別するとともに、振幅値又は強度値のベクトルに関連しかつステップ(f)の検定に合格しなかった画素を、サンプル画像と均質ではない画素（４）であると識別するステップと、
(h) 均質な画素（２、３）のサンプル画素への連結検定を達成するステップと、
(i) 推定窓（１０）に含まれている画素において、振幅値又は強度値のベクトルに関連

しかつステップ(f)の検定に合格していても、直接的にあるいはサンプル画素と均質な他の画素を介して、サンプル画素に連結していないためサンプル画素と均質ではない画素を除去するステップと、

(j) サンプル画素と均質かつ連結している画素を、統計的に均質な画素として識別するステップ。